

オートモーティブデバイスの前工程から後工程まで各種検査システムをラインナップ  
Power semiconductor Front-End / Back-End Test System

## NATS®-1302/1303



Wafer

Die / Chip



## KGD AC/DC Test System

NATS-1302 : DC/AC Test  
Multiple Temp Control ~200°C  
3 Stage + Liner Handler Type  
UPH 1000 chips

NATS-1303 : DC/AC Test  
Multiple Temp Control ~200°C  
4 Stage + Index Handler Type  
UPH 2000 chips

ウェハーからダイ、チップレベルに対応する  
各種ハンドラーを取り揃え、高スループット  
Applied to Wafer / Die / Chip level and high-through put

## NATS®-1202



DBC / AMB

## DBC/AMB Test System

最大3000A / 1500V

ワイヤボンディング前後のDBCおよびAMBの静的/動的機能検査に対応  
Static and dynamic functionality tester for DBC and AMB before/after wire bonding

AQG324 試験規格 Silicon Carbide FET 対応機種 | AQG324 test standard Silicon carbide FET compatible model

## NATS®-8151/8152



Module

## Dynamic HTRB HTGB Tester

高温逆バイアス DHTRB / 高温ゲートバイアス DHTGB

広い周波数範囲と柔軟なパラメータ設定に対応するAC/DCテストが可能  
Wide range frequency / Flexible setting AC/DC test available

## NATS®-8153



## Dynamic H3TRB Tester

高温高湿逆バイアス Dyn H<sup>3</sup>TRB

複数レイヤーを個別 / 同時実行を可能とし最小動作単位は1レイヤーから設定可能  
Individual / simultaneous execution setting of multiple layers,  
and the Minimum operation unit can be set from 1 layer

## NATS®-8140



## Continuous Power Characterizer

連続出力特性検査 | Continuous Power Characterize

CMTI : Max200kV/μs  
Output Phase Current : 800Arms  
Frequency : 1000Hz

### 国内拠点

・京都(本社)  
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟  
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106  
・名古屋  
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3  
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685  
・東京  
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル  
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

### 海外拠点

・台湾  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION  
・韓国  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.  
・中国  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION  
・タイ  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.  
・マレーシア  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.  
・ベトナム  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.  
・インド  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED  
・カナダ  
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION